

# AGT-826 膜厚計簡易說明書

( \* 本機種可自調校正，無須定時回廠校正)

## 儀器啟動及關機

1. 裝上電池，在平整桌上放上所需探測基材(如：鐵或鋁基材)
2. 以兩手平壓儀器至探頭壓上基材約一秒並迅速遠離 5 公分以上
3. "滴滴" 聲即開機完成
4. 儀器不使用 60 秒後自動關機

## 使用基本說明

1. 嚴禁將校準片兩片重疊使用此方式並不準確
2. 待測物曲率半徑過陡或面積過小或表面過粗糙
3. 取至少三點以上作平均值
4. 嚴禁電池電量不足時
5. 嚴禁環境溫差過大時
6. 嚴禁附近有強磁場時
7. 建議使用鋁基材(非磁)時就連續使用鋁基材(非磁)；若使用鐵基材(磁性)就連續使用鐵基材(磁性)。不建議跳來跳去使用。



左列圖示按鍵排列編

號如下：

2  
1            3  
4

## 校準說明

- 如需對特定材料測量，可對需要測量的底材做零點校準，如下：
- 零點校準操作說明：
  - A.平整桌上置上所需要探測材質之基材，開機完成後並對桌上基材進行測量，若顯示非“0.0”
  - B.長按“4”鍵約三秒，再重新測量即可得歸零
  - C.若無法歸零可重複 A 及 B 步驟一至兩次可得歸零校準
- 以不同規格的校準片對底材進行多點校準，可確保儀器在不同特

性的底材上數據之準確性

●校準片校準說明：

- A.長按“3”鍵，螢幕左上角顯示“CRL”，進入校準模式。
- B.螢幕右下角顯示“1”，主顯示區顯示校準值“0.0”，即表示需做零點校準。請在磁性或非磁性金屬標準底材上測量一次，儀器會“滴滴”兩聲並自動跳到下一個校準點“2”。
- C.此時螢幕左下角顯示“2”，顯示區顯示“50.0”(也可能顯示 45~55)，請將 50um 校準片置於剛剛測量之零點基材上，再量測一次若數值與標準片不一致可短按“2”鍵或“4”鍵調整至同數值，再測量一次，50um 校準完成並自動跳到下一個校準點。
- D.參考上一步驟 C 繼續完成校準 3.(100um)，4.(250um)，5.(500um)，6.(1000um)，完成後會留在 1000 數值即表示校準完成。可以開始量測使用!!
- E.若只想對一單點進行校準，可在校準模式下按“3”鍵進行切換校準點，按壓“1”鍵可退出校準模式。
- F.當退出校準模式，儀器顯示“Err”，表示校準數據有誤，儀器會自動跳回上組數據，請按“1”鍵返回主介面並選用正確標準片重新量測。

## 基本測量

●單次測量(系統默認此模式)

A.開機

B 將儀器以兩手平整壓上待測件，” 滴” 一聲完成測量顯示數值，迅速移開儀器至少遠離 5 公分以上，約一秒鐘後可量測下一點

●連續測量

A.開機方式較特殊，將儀器按壓在待測件上不鬆開，短按 3” 鍵，儀器左上顯示” San” 即進入連續測量模式

關閉方式為將儀器按壓在待測件上不鬆開，短按"3"鍵，即退出連續模式

## 儲存/刪除

●儲存紀錄

A.短按” 1” 鍵可存該筆紀錄

B.當存儲紀錄大於 30 筆即顯示” FUL”

●查看紀錄

A.在主顯示區短按” 2” 或” 4” 鍵可察看紀錄，此時左上角顯示” REC”

B.直接測量或短按” 1” 鍵可退出儲存模式

●刪除紀錄

A.在查看紀錄模式下短按” 3” 鍵會立刻刪除該筆紀錄

B. 在查看紀錄模式下長按” 3” 鍵會立刻刪除全部紀錄

### ●單位設置

本儀器提供兩種單位，可長按” 2” 鍵來選擇

## 技術參數

類型	<b>Fe 鐵基 (磁性)</b>	<b>NF 非鐵 (非磁)</b> (鋁及銅等非磁性基材)
原理	電磁感應	渦流效應
測量範圍	<b>0-1700um</b>	
精度	正負 <b>(2+2%<math>\times</math>H)um (0-500um)</b> 正負 <b>(2.5%<math>\times</math>H)um (500-1700um)</b>	
分辨率	<b>0.1um(0~99.9um)</b> <b>1um(100~1700um)</b>	
校準	零點校準及多點校準	
單位	<b>um(微米)/mil(密耳)(美國慣用單位)</b>	
最小凸面曲率半徑	<b>5mm</b>	
最小凹面曲率半徑	<b>30mm</b>	
最小測量面積直徑	<b>25*25mm</b>	
超作環境	<b>0-50°C, 10%-80%RH 無強磁場環境</b>	
最小基材厚度	<b>0.2mm</b>	<b>0.05mm</b>
電源	<b>2 顆三號電池(AAA)</b>	